

STEM Scietex F50

СИСТЕМА БЫСТРОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРОЧАСТИЦ 50 КВ



50 кВ полностью автоматизированный сканирующий просвечивающий электронный микроскоп (STEM) с запатентованной технологией съемки для быстрого анализа и морфологии биологических объектов с использованием алгоритмов искусственного интеллекта (AI). Отлично подойдет для исследований патологических срезов тканей, мозга и др.

- **Высокое разрешение:** совершенно новая конструкция оптической системы, способная получать изображения как с высоким разрешением 1,0 нм при 50 кВ (1 нА), так и с большим полем зрения (искажение менее 1%).
- **Быстрая визуализация:** высокоскоростной STEM детектор со скоростью получения изображений 100 млн пикселей в секунду.
- **Полностью автоматическая загрузка образцов и навигация:** одновременная загрузка 5 образцов с функцией запроса информации об образцах, что обеспечивает автоматизацию управлением навигацией.
- **Стабильный и надежный:** круглосуточный автоматический непрерывный сбор изображений.

Катод	Катод с полевой эмиссией типа Шоттки	Увеличение	1X–500X (оптическая визуализация) 500X–800 000X (изображения STEM)
Разрешение	1 нм при 50 кВ (1 нА)	Столик	X=±4 мм, Y=±4 мм, точность 1 мкм
Ток пучка	От 50 пА до 100 нА	Скорость съемки	100 МБ/с, для захвата одного изображения 24k x 24k требуется всего 6,5 с
Режим съемки	BF / DF		
Ускоряющее напряжение	0 – 50 кВ		



SEM Scietex F12

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
МИКРОСКОП С АВТОЭМИССИОННЫМ
КАТОДОМ

SEM Scietex F12 обладает высокой производительностью за счет инноваций в технологии получения изображений и уникальных особенностей конструкции, при этом скорость визуализации превышает традиционные электронные микроскопы в десятки раз. В **SEM Scietex F12** применяются детекторы с прямым преобразованием электронов, которые помогают преодолевать ограничения обычных электронных микроскопов по скорости, точности и повреждению образца. Таким образом сканирующий электронный микроскоп превращается из традиционной nano-«фотокамеры» в nano-«видеокамеру». Области применения: науки о жизни, исследование материалов, полупроводниковая промышленность и геологические ресурсы.

- Быстрая визуализация
- Высокое качество изображения
- Кросс-масштабная визуализация образцов с большой площадью поверхности
- Интеллектуальный анализ
- Способность к круглосуточной автономной работе

Катод	Высокостабильный катод с полевой эмиссией типа Шоттки	Объективная линза	Электромагнитная с функцией замедления пучка (BD mode)
Разрешение	1.5 нм при 1 кВ 1.3 нм при 3 кВ	Рабочее расстояние	1,5 мм
Ускоряющее напряжение	0.1–12 кВ	Максимальное поле зрения	100 мкм - 1 мм
Увеличение	500X~600,000X (изображение SEM)	Столик	X=150 мм, Y=150 мм, Z=20 мм (5 кг)
Детекторы	In-column SE; In-lens BSE	Скорость съемки	SE и BSE - 100Мп/с
Ток пучка	50 пА – 30 нА		

